

Компонент ОПОП 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы
наименование ОПОП
Б1.В.ДВ.02.01
шифр дисциплины

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Дисциплины
(модуля)

Физические основы электроники

Разработчик (и):
Шульженко А.Е.
ФИО
старший преподаватель
должность

ученая степень,
звание

Утверждено на заседании кафедры

РЭСиТРО

наименование кафедры

протокол № 1 от 01.09.2022 года

Заведующий кафедрой РЭСиТРО

Борисова Л.Ф.

ФИО

подпись

1. Критерии и средства оценивания компетенций и индикаторов их достижения, формируемых дисциплиной (модулем)

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора(ов) достижения компетенции ¹ | Результаты обучения по дисциплине (модулю) ² | | | Оценочные средства текущего контроля | Оценочные средства промежуточной аттестации |
|---|---|---|---|--|--|---|
| | | Знать | Уметь | Владеть | | |
| ОПК-2 Способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-математический аппарат для их формализации, анализа и принятия решения | ИД-1опк-2 Решает профессиональные задачи, применяя физико-математический аппарат | приёмы решения задач анализа и расчета характеристик полупроводниковых приборов; - методы измерения электронных приборов; - принципы обработки полученных данных; | - решать задачи анализа и расчета характеристик полупроводников, применяя соответствующий математический аппарат - составлять измерительные схемы; - обрабатывать полученные данные, делать выводы; | навыками решения задач анализа и расчета характеристик свойств полупроводников, применяя соответствующий математический аппарат - навыками проведения экспериментов с электронными приборами. | - комплекс заданий для выполнения лабораторных работ; - тестовые задания; - типовые задания по вариантам для выполнения расчетно-графической работы; | Результаты текущего контроля |

¹Указываются только те индикаторы, которые закреплены за дисциплиной (модулем) в соответствии с РПД

²В соответствии с РПД

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|-------------------------------------|
| <p>ПК-3 Способен к реализации программ экспериментальных исследований, в том числе в режиме удаленного доступа, включая выбор технических средств, обработку результатов и оценку погрешности экспериментальных данных</p> | <p>ИД-1пк-3</p> <p>Проводит экспериментальные исследования с применением средств обработки данных</p> | <p>принципы планирования экспериментальных исследований.</p> | <p>обосновывать программу эксперимента, обрабатывать результаты эксперимента, оценивать погрешности экспериментальных данных.</p> | <p>техникой проведения экспериментальных исследований.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - комплект заданий для выполнения лабораторных работ; - тестовые задания; - типовые задания по вариантам для выполнения расчетно-графической работы; | <p>Результаты текущего контроля</p> |
|--|---|--|---|--|--|-------------------------------------|

2. Оценка уровня сформированности компетенций (индикаторов их достижения)

| Показатели оценивания компетенций (индикаторов их достижения) | Шкала и критерии ³ оценки уровня сформированности компетенций(индикаторов их достижения) | | | |
|---|--|---|--|--|
| | Ниже порогового «неудовлетворительно») | Пороговый «удовлетворительно») | Продвинутый «хорошо») | Высокий «отлично») |
| Полнота знаний | Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки. | Минимально допустимый уровень знаний. Допущены не грубые ошибки. | Уровень знаний в объёме, соответствующем программе подготовки. Допущены некоторые погрешности. | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. |
| Наличие умений | При выполнении стандартных заданий не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки. | Продемонстрированы основные умения. Выполнены типовые задания с не грубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме (отсутствуют пояснения, неполные выводы) | Продемонстрированы все основные умения. Выполнены все основные задания с некоторыми погрешностями. Выполнены все задания в полном объёме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения. Выполнены все основные и дополнительные задания без ошибок и погрешностей. Задания выполнены в полном объеме без недочетов. |
| Наличие навыков (владение опытом) | При выполнении стандартных заданий не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки. | Имеется минимальный набор навыков для выполнения стандартных заданий с некоторыми недочетами. | Продемонстрированы базовые навыки при выполнении стандартных заданий с некоторыми недочетами. | Продемонстрированы все основные умения. Выполнены все основные и дополнительные задания без ошибок и погрешностей. Продемонстрирован творческий подход к решению нестандартных задач. |
| Характеристика сформированности компетенции | Компетенции фактически не сформированы. Имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач. ИЛИ Зачетное количество баллов не набрано согласно установленному диапазону | Сформированность компетенций соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач. ИЛИ Набрано зачетное количество баллов согласно установленному диапазону | Сформированность компетенций в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков достаточно для решения стандартных профессиональных задач. ИЛИ Набрано зачетное количество баллов согласно установленному диапазону | Сформированность компетенций полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в полной мере достаточно для решения сложных, в том числе нестандартных, профессиональных задач. ИЛИ Набрано зачетное количество баллов согласно установленному диапазону |

³Критерии могут быть уточнены/изменены на усмотрение разработчика ФОС

3. Критерии и шкала оценивания заданий текущего контроля

3.1 Критерии и шкала оценивания лабораторных работ

Перечень лабораторных работ, описание порядка выполнения и защиты работы, требования к результатам работы, структуре и содержанию отчета и т.п. представлены в методических материалах по освоению дисциплины (модуля) и в электронном курсе в ЭИОС МГТУ.

| Оценка/баллы ⁴ | Критерии оценивания |
|----------------------------|--|
| Отлично | Задание выполнено полностью и правильно. Отчет по лабораторной/практической работе подготовлен качественно в соответствии с требованиями. Полнота ответов на вопросы преподавателя при защите работы. |
| Хорошо | Задание выполнено полностью, но нет достаточного обоснования или при верном решении допущена незначительная ошибка, не влияющая на правильную последовательность рассуждений. Все требования, предъявляемые к работе, выполнены. |
| Удовлетворительно | Задания выполнены частично с ошибками. Демонстрирует средний уровень выполнения задания на лабораторную/практическую работу. Большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены. |
| Неудовлетворительно | Задание выполнено со значительным количеством ошибок на низком уровне. Многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. ИЛИ Задание не выполнено. |

3.2 Критерии и шкала оценивания расчетно-графической работы

Перечень контрольных заданий, рекомендации по выполнению представлены в методических материалах по освоению дисциплины (модуля) и в электронном курсе в ЭИОС МГТУ.

В ФОС включен типовой вариант контрольного задания.

1. Уровень Ферми в примесных полупроводниках N_1 и N_2 находится на ΔE ниже дна зоны проводимости (Значение $\Delta E = \Delta E_3/Z$) (Z -номер варианта).

1.1, 1.2. Какова вероятность $f_n(E)$ того, что при температуре T . энергетические уровни, расположенные на $Z \cdot 3 \cdot kT$ выше зоны проводимости, заняты электронами.

1.3, 1.4. Какова вероятность $f_p(E)$ того, что на уровне, расположенному у потолка валентной зоны, содержатся дырки.

1.5. Нарисовать зонную диаграмму и функции $Z(E)$, $N(E)$ $f(E)$ для данных полупроводников.

2. Имеются собственные полупроводники N_1 и N_2 .

2.1, 2.2. Рассчитать концентрацию собственных носителей в материалах N_1 , N_2 при температуре T при известных значениях m_n, m_p для носителей заряда.

2.3, 2.4. Определить, во сколько раз различаются вероятности заполнения электронами нижнего уровня проводимости в собственных материалах при T и T_x .

2.5, 2.6. Определить положение уровня Ферми ($E_{np} - E_\phi$) при температурах T и T_x , для материалов N_1 и N_2 .

2.7 Рассчитать и построить зависимость $\ln n_i(1/T)$ для материалов N_1 и N_2 (на одном графике)

3. Имеются примесные полупроводники.

В материале N_1 находится примесь N_{np1} ; в материале N_2 - примесь N_{np2} .

⁴Шкала оценивания определяется разработчиком ФОС

3.1,3.2. Определить температуру ионизации T_s примесей в материалах N_1 и N_2 (учесть, что N_c и N_v зависят от температуры).

3.3, 3.4. Определить температуру перехода к собственной проводимости T_i в материалах N_1 и N_2 (учесть, что N_c и N_v зависят от температуры).

3.5, 3.6. Учитывая значения величин T_i и T_s определить концентрацию основных и неосновных носителей в материале N_1 при температуре T .

3.7, 3.8. Учитывая значения величин T_i и T_s определить концентрацию основных и неосновных носителей в материале N_2 при температуре T .

3.9, 3.10. Определить концентрацию основных и неосновных носителей в материале N_1 при температуре ($T+0.1T$)

3.11. Построить качественно зависимость концентрации основных носителей $\ln n(1/T)$ для материалов N_1 и N_2 (на одном графике).

4. Имеется материал N_1 (или N_2) с примесями концентрацией N_{np2} (или N_{np1}). Плотность тока через образец равна $j = 10^5 \text{ A}$, температура T .

4.1, 4.2. Определить тепловую скорость основных и неосновных носителей.

4.3, 4.4. Определить дрейфовую скорость основных и неосновных носителей.

4.5 Определить отношение полного тока через образец к току, обусловленному дырочной составляющей.

4.6. Определить удельное сопротивление материала $\rho(T)$.

4.7. Рассчитать значение проводимости материала N_1 (или N_2) при известных значениях подвижности μ_n , μ_p при температуре ($T+0.3T$).

Исходные данные

| | Номер варианта | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | $N_1 - Si : \Delta E_3 = 1,11 \text{ эВ (300К)} ; N_2 - Ge : \Delta E_3 = 0,72 \text{ эВ (300К)}$ | | | | | | | | | |
| T, K | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 |
| T_x, K | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
| Пр1 | As | P | Sb | As | P | Sb | As | P | Sb | As |
| Пр2 | In | B | Al | In | B | Al | In | B | Al | In |
| N_{np1} | 10^{20} | 10^{23} | 10^{21} | 10^{24} | 10^{22} | 10^{23} | 10^{21} | 10^{24} | 10^{22} | 10^{23} |
| N_{np2} | 10^{22} | 10^{20} | 10^{23} | 10^{22} | 10^{24} | 10^{20} | 10^{23} | 10^{22} | 10^{24} | 10^{21} |
| $\mu, m^2/Bc$ | Значения выбираются по графикам $\mu(N_{np})$ (см. рис.1 и рис.2) с учетом влияния температуры: $\mu(T) = \mu(300) (T/300)^{-3/2}$ | | | | | | | | | |

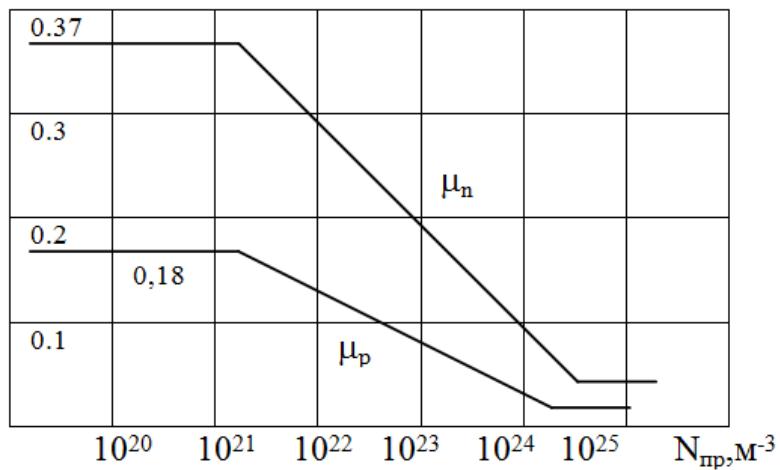


Рис.1. Зависимость подвижности электронов и дырок в германии от концентрации примесей (300К)

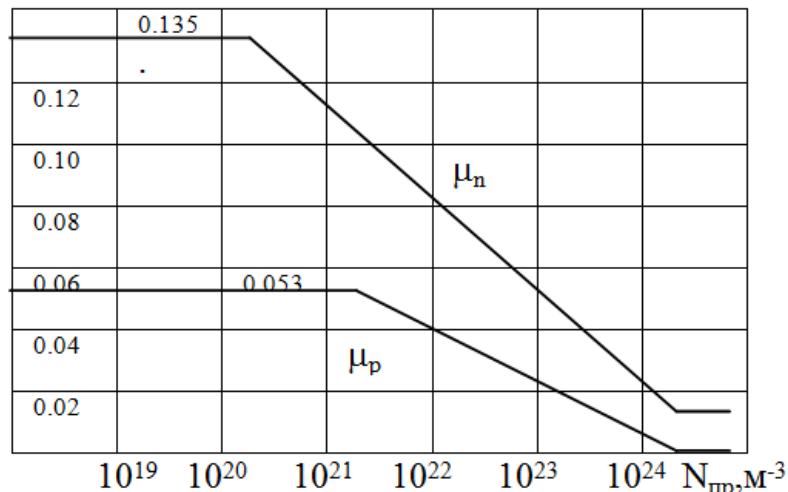


Рис.2. Зависимость подвижности электронов и дырок в кремнии от концентрации примесей (300К)

Вариант для расчета выбирается по последней цифре номера зачетной книжки студента.

| Оценка/баллы ⁵ | Критерии оценивания |
|----------------------------|--|
| Отлично | Работа выполнена полностью, без ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием непонимания материала). |
| Хорошо | Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны, допущена одна грубая ошибка или два-три недочета, не влияющих на правильную последовательность рассуждений. |
| Удовлетворительно | В работе допущено более одной грубой ошибки или более двух-трех недочетов, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. |
| Неудовлетворительно | В работе есть грубые ошибки и недочеты |

⁵Шкала оценивания определяется разработчиком ФОС

| | |
|--|---|
| | ИЛИ Контрольная работа не выполнена. |
|--|---|

4. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) при проведении промежуточной аттестации

Критерии и шкала оценивания результатов освоения дисциплины (модуля)
с зачетом

Если обучающийся набрал зачетное количество баллов согласно установленному диапазону по дисциплине(модулю), то он считается аттестованным.

| Оценка | Баллы | Критерии оценивания |
|------------------|----------|---|
| <i>Зачтено</i> | 60 - 100 | Набрано зачетное количество балловсогласно установленному диапазону |
| <i>Незачтено</i> | менее 60 | Зачетное количество согласно установленному диапазону баллов не набрано |

5. Задания диагностической работы для оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) в рамках внутренней независимой оценки качества образования

ФОС содержит задания для оценивания знаний, умений и навыков, демонстрирующих уровень сформированности компетенций и индикаторов их достижения в процессе освоения дисциплины (модуля).

Комплект заданий разработан таким образом, чтобы осуществить процедуру оценки каждой компетенции, формируемой дисциплиной (модулем), у обучающегося в письменной форме.

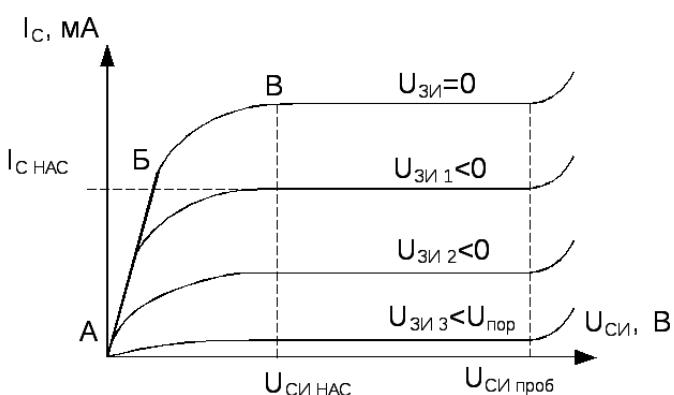
Содержание комплекта заданий включает: тестовые задания.

Комплект заданий диагностической работы

| | |
|---|--|
| Компетенция ОПК-2 Способен осуществлять испытания радиоэлектронных систем и комплексов, анализировать их результаты | |
| 1 | Что такое валентная зона, зона проводимости и запрещенная зона? |
| 2 | Принцип работы р-п перехода. |
| 3 | Концентрация носителей заряда в собственном полупроводнике. |
| 4 | Входная ВАХ биполярного транзистора. |
| 5 | Выходная ВАХ биполярного транзистора |
| 6 | Концентрация носителей заряда в примесном полупроводнике |
| 7 | Какие материалы используют для создания полупроводников донорного типа |
| 8 | Какие электроны называются свободными |

Компетенция ПК-3 Способен к реализации программ экспериментальных исследований, в том числе в режиме удаленного доступа, включая выбор технических средств, обработку результатов и оценку погрешности экспериментальных данных

- | | |
|---|--|
| 1 | Опишите методику измерения коэффициента усиления по току для партии биполярных транзисторов |
| 2 | Измерьте коэффициент усиления тока для биполярного транзистора используя данный вам измеритель |
| 3 | Опишите методику измерения крутизны проходной характеристики для партии полевых транзисторов |
| 4 | Опишите методику измерения емкости для партии диодов |
| 5 | Опишите методику измерения сопротивления в открытом состоянии для партии диодов |
| 6 | Опишите методику измерения выходной проводимости для партии транзисторов |
| 7 | Единцы измерения проводимости |
| 8 | Какое из представленных изображения соответствует выходной ВАХ полевого транзистора 1) |



2)

